Максименко Зоя Василівна, науковий співробітник відділу структурного і елементного аналізу матеріалів і систем Інституту фізики напівпровідників імені В. Є. Лаш- карьова НАН України: «Резонансна рентгенівська дифрак- тометрія поблизу К-країв поглинання компонент при до­слідженнях багатошарових структур» (01.04.07 - фізика твердого тіла). Спецрада Д 26.199.01 в Інституті фізики на­півпровідників імені В. Є. Лашкарьова